# 速度分布関数に基づくビーム集束性の評価

- 核融合プラズマ加熱用負イオンビームの品質向上に向けて -

日大生産工	○波場	泰昭	荒巻う	光利
核融合科学研究所	永岡	賢一	津守 う	克嘉

## 1. まえがき

核融合炉は、次世代の基幹エネルギー源とし て期待されている.日本も参画している国際プ ロジェクトであるITER計画では、2025年の核 融合実験炉の運転開始に向けて、磁場閉じ込め 型核融合プラズマを加熱するために中性粒子 ビーム入射加熱装置の開発が進められている. 高速な中性粒子を生成するためには、高エネル ギー領域(>100 keV)でも高い中性化効率を 有する水素負イオンビームが必須となる.

高周波放電方式を用いた負イオンビームの 発散角の抑制は中性粒子ビーム入射加熱装置 の重要な開発課題の1つで,現時点で14 mrad のビーム発散角が得られている(参考文献1).

この値はITER計画の仕様(3-7 mrad)に対し て2-4倍以上大きく、この要求を満たすにはビ ームの制御性を格段に向上させる必要がある. 図1に示すように、負イオン源(負イオンビ ームを生成する装置)から負イオンが引き出さ れる機構は三通りあると考えられている. 第一 の機構(I)では、バルクプラズマ領域で生成 (体積生成)された負イオンが,初段の電極(プ ラズマ電極) 孔中央から引き出される. 第二の 機構(Ⅱ)では, プラズマ電極表面で生成(表面 生成) された負イオンが、 バルクプラズマを経 由して引き出される. 第三の機構(Ⅲ)では、表 面生成された負イオンが,バルクプラズマを経 由せずに, プラズマ電極孔縁部から直接引き出 される.これらの異なる生成過程および引出経 路を起源とする負イオンは,異なる速度分布関 数を持ってビーム加速電極が成す静電レンズ に入射するため,生成される負イオンビームの 集束性を必然的に低下させる.従って、ビーム



の集束性を極限まで向上させるには、これら三 つの引出機構を理解し、制御する必要がある.

#### 2. 提案手法

負イオン源からの負イオンビーム引出機構 には複数の素過程および輸送過程が関わって おり,負イオンビームの集束性を向上させるこ とは容易ではない.加えて,負イオンが引き出 されると同時に電子も引き出されるため,下流 に位置する電極内部に電子を除去するための 磁石を埋め込む必要がある.この磁石により形 成される磁場は,ビーム引出領域にも伸長して いる.そのため,負イオン源では,ビーム引出 領域において負イオンは複雑な速度分布関数 を持つと予想される(図2参照).



図2 負イオンビームとその速度分布関数.

そこで本研究では、負イオン源の引出領域に おける負イオンの生成・輸送過程と、負イオン ビームの速度分布関数との関係を明らかにし、 その知見をもとに負イオンビームの集束性を 極限まで向上させることを提案する.

#### 3. 実験方法および測定方法

図3に, 負イオンビームの速度分布関数を計 測する原理を示す. 測定対象のビームを格子状 に配列させたピンホールアレイに照射するこ とで細かく分離する. ピンホールを透過したビ



Evaluation of the Beam Divergence Based on Velocity Distribution Functions — Toward the Optimization of Negative Ion Beams for Fusion Plasma Heating — Yasuaki HABA, Mitsutoshi ARAMAKI, Kenichi Nagaoka and Katsuyoshi TSUMORI ームは一定距離進行した後,カプトン箔に照射 され照射痕を残す.照射痕の強度は,ビーム電 流密度の時間積分に比例して大きくなる(参考 文献2).この照射痕は図4に示すように,ビ ーム断面内の速度分布に依存して分裂してお り,これらを分離することでそれぞれの速度分 布関数が得られる.本計測器では,単孔から引 き出された負イオンビームの速度分布関数を 高分解能で計測することが可能となる.



図 4 ピンホールによって分割されたビームによる 照射痕.

## 4. 実験結果および検討

図5に、核融合科学研究所の負イオン源から 引き出された単一の負イオンビームを複数の 速度分布成分に分離した結果を示す.それぞれ の速度分布成分が持つ水平方向の速度成分  $(v_x)$ と垂直方向の速度成分 $(v_y)$ との関係(ビー ム進行方向の速度 $v_z$ で規格化)が明らかにされ、 それぞれの速度分布成分が固有に持つ発散角、 重心および含有率を評価することが可能とな った.ビーム中心近傍に位置する速度成分(b) は、最も小さく(含有率19%)、縦長構造を持 つ.一方、速度成分(a)と(c)の二成分は大きく (含有率はそれぞれ41%と40%)、ビーム外縁 部に位置する.これらの異なるビームパラメー タを持つ成分は、必然的に静電レンズに対して 異なる集束特性を持つため、ビーム全体として の集束性が制限される.それぞれの速度分布成 分の含有率は、負イオン源から引き出された時 点で決まっているため、プラズマ電極より下流 の静電レンズで制御することはできない(参考 文献3).一方、各速度成分の重心は、ある程 度の制御が可能となるが、異なるビームパラメ ータを持つため完全に集束させることは不可 能である.

本計測の結果は、負イオン源から引き出され た負イオンビームには複数の速度分布成分が 内在しており、これがビームの集束性を制限し ていることを明らかにしている.それぞれの速 度分布成分(図5の(a)-(c))とビーム引出機構 (図1の(I)-(III))との対応関係を明らかにす るとともに、それぞれの速度分布成分が固有に 持つ制御パラメータを同定し、負イオンビーム の集束性を極限まで向上させることが今後の 研究課題となる.

## 5. まとめ

負イオンビームの速度分布関数を高分解能 で計測する技術を開発し、負イオンビームが複 数の速度分布成分の重ね合わせで構成されて いることを世界で初めて見出し、このことがビ ームの集束性を制限していることを示した.

### 参考文献

- 1) A. Hurlbatt et al, AIP Advances **11**, 025330 (2021).
- Y. Haba et al, "Development of a dual beamlet monitor system for negative ion beam measurements", Rev. Sci. Instrum. 89, 123303 (2018)
- Y. Haba et al, "Characterisation of negative ion beam focusing based on phase space structure", New J. Phys. 22, 023017 (2020)



図 5 負イオンビームに内在する複数の速度分布成分に対する二次元速度分布.(a) -x方向にドリフトした成分,(b) ビーム中心近傍に位置する成分,(c) +x方向にドリフトした成分.